



santec

+

moglabs

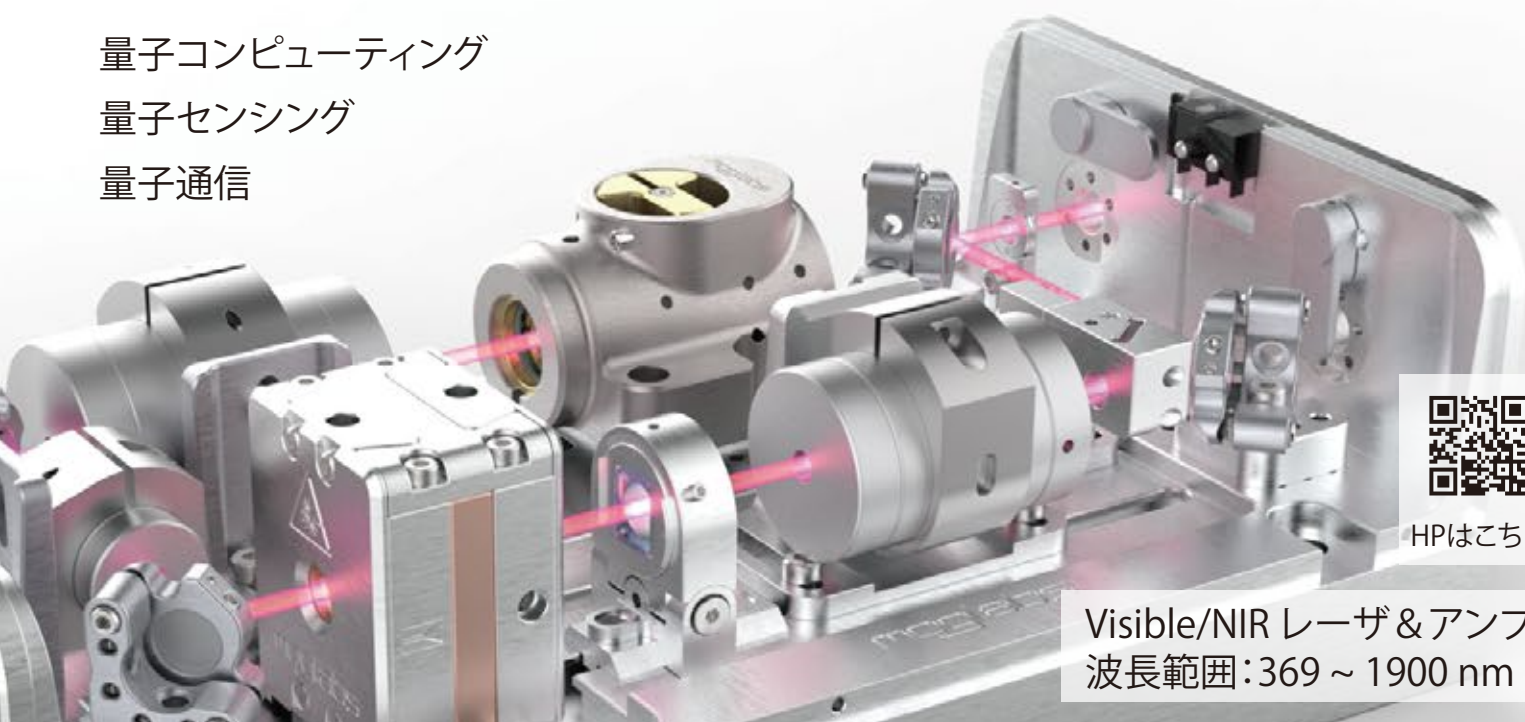
a santec company

MOGLabs が santecグループ に仲間入りしました

量子コンピューティング

量子センシング

量子通信



HPはこちら

Visible/NIR レーザ & アンプ
波長範囲: 369 ~ 1900 nm

MOGLabs製品ラインナップ

Cateyeレーザ (CEL)



Littrowレーザ (LDL)



リニアキャビティSHGシステム (MSL)



ファイバアンプ (MGPA)



サーボコントローラ (FSC)



フィゾー波長計 (FZW)



研究・開発に最適な光応用製品



■ 波長可変レーザー

スタンダードモデル TSL-570



- ・ SCL/CL/O/ES/Ext O/Ext ES Band 対応
- ・ 波長精度 (±20 pm/±5 pm/±2 pm) 選択可
- ・ 最大パワー +13 dBm



ハイパワーモデル TSL-570 Type H



- ・ 最大パワー +20 dBm
- ・ 広帯域波長可変
1260 ~ 1360 nm / 1500 ~ 1630 nm



■ 安定化光源

安定化光源 SLS-100



- ・ 最大 24ch の複数波長出力可能
- ・ 1 ポートに複数ソースをカスタム可能
(850/1300 nm, 1310/1550 nm)



光周波数コム WSC-100 * Preliminary



- ・ コム生成周波数: 25 ~ 30 GHz
- ・ コム生成帯域幅: > 20 nm (-17 dB 幅)
- ・ パルス幅: < 3 ps

■ 周波数ロックユニット

レーザーボコントローラ LLP-100



- ・ レーザ発振周波数の安定度を大幅に向上
(狭線幅 < 50 kHz)
- ・ 専用ソフトウェアによる高度な連動制御



■ 波長可変フィルタ

OTF-980 (Flat Top, 電動制御タイプ)



- ・ 波長範囲 1525 ~ 1610 nm (O Band 対応可)
- ・ フィルタスロープ 最大 1000 dB/nm
- ・ 透過波長 / 帯域幅可変



■ スペクトル整形器

LCOS ベースの WSS エミュレータ WSS-2000



- ・ 動作帯域幅 10 ~ 4900 GHz
- ・ 優れた光フィルタ特性 (Typ. 400 dB/nm)
- ・ 位相コントロール機能 (オプション)



■ 光パワーメータ

高性能光パワーメータ OPM-200



- ・ 空間入力 2mm InGaAs デテクタ
- ・ 広いダイナミックレンジ -80 ~ 8 dBm
- ・ 多芯コネクタの測定に最適 積分球対応



■ 光スイッチ

メカニカル光スイッチ OSX-100



- ・ 最大 400ch 対応可能
- ・ 超低挿入損失 < 0.5 dB
- ・ 高再現性 ±0.005 dB



■ 光アッテネータ

光アッテネータ OVA-100



- ・ 高精度 ±0.1 dB / 高再現性 ±0.01 dB
- ・ 高ダイナミックレンジ 100 dB
- ・ ビットエラーテストに最適



■ 光学特性検査装置

OFDR によるフォトニクスアナライザ SPA-110



- ・ 業界最高水準の高分解能 < 5 μm
- ・ 広いダイナミックレンジ > 80 dB
- ・ 広い波長範囲での WDL 測定
(最大 160 nm)



光学特性検査システム STS



- ・ 高再現性 IL/WDL/PDL 特性測定
(IL < ±0.02 dB / PDL ±0.01 dB)
- ・ マルチチャンネル測定可能
- ・ 高い波長分解能と波長精度



■ LCOS 型空間光変調器

高出力レーザー対応モデル SLM-310 * Preliminary



- ・ 波長範囲 1020 ~ 1100 nm
- ・ 高出力レーザー (1 kW) 対応
- ・ 水冷ヒートシンクを備えた LCOS ヘッド



高出力レーザー対応モデル SLM-300



- ・ 対応波長 532, 800, 1064 nm
- ・ 高出力レーザー (200W クラス) 対応
- ・ 水冷ヒートシンクを備えた LCOS ヘッド



ハイスピードモデル SLM-210



- ・ 波長範囲 450 ~ 1600 nm
- ・ 応答速度 10 ms 以下
- ・ 10-bit (1024) 階調



■ 非破壊・非接触 形状測定器

ウェハ厚分布測定器 TMS-2000



- ・ 高繰り返し精度 ≤ 1 nm
- ・ 独自特許による高い耐環境性
- ・ スパイラルスキャン方式による高速測定



光学断層測定器 IVS シリーズ



- ・ 高軸方向分解能 < 9 μm @ Air (HR モデル)
- ・ A-line レート 最大 400 kHz (VCSEL モデル)
- ・ 中心波長 1310 nm / 1050 nm



■ Visible/NIR レーザー群

外部共振器型 Cateye SAF レーザ CES



- ・ 波長範囲 960 ~ 1970 nm
- ・ 最大出力 250 mW
- ・ 線幅 < 100 kHz



外部シードテーパードアンプ MOAL



- ・ 対応波長範囲 650 ~ 1080 nm
- ・ 最大出力 5 W
- ・ 交換可能な TA ダイオード



リニアキャビティ SHG システム MSL



- ・ 高い周波数変換効率 (80 ~ 90%)
- ・ 広い波長範囲で周波数通倍が可能
(370/740 ~ 553/1107 nm)



www.santec.com

santec Japan株式会社 フォトニクスバレー大草キャンパス

〒485-0802 愛知県小牧市大草年上坂5823 Tel. 0568-79-3536 (営業直通) Fax 0568-79-1718

